 earch Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent unde Reexamination	r
10/714,424	NAIR	
Examiner	Art Unit	
Edward H. Tso	2838	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
320	134	11/1/2006	ET
***	136		
	150		
			•

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		··		

SEARCH N (INCLUDING SEARC	IOTES CH STRATEG	Y) (
	DATE	EXMR
		į
.*		
		_
•		